

## **Optikai mérés technika / Optical Metrology (2/0/0/v/3)**

Tárgyfelelős / Responsible lecturer: Kornis János

A tantárgy célja áttekintést adni az optikai mérés technika módszereiről és ismertetni a legújabb eljárásokat és eredményeket. Témakörök: Optikai mérőrendszerek elemei. Fényforrások, detektorok, rögzítőanyagok. Optikai elemek sajátosságainak mérés technikája. Szög-, hosszúság-, párhuzamosság mérése klasszikus optikai és koherens optikai módszerekkel. Heterodin és fázistolásos interferometria. Holografikus és szemcsekép interferometria. Digitális holográfia. Optikai adatfeldolgozási módszerek a szemcsekép mérés technikában. Fotoelaszticitás. Fényvezetőszál érzékelők. Színmérés, színes detektáláson alapuló mérés technika.

The goal is to present an overview of the methods of optical metrology and present the most recent techniques and results. Topics: Elements of the optical measuring systems. Light sources, detectors, recording materials. Measurement of optical properties of the optical elements. Measurement of angle, length, and flatness by classical methods and using coherent optics. Heterodyne and phase stepping interferometry. Holography and speckle metrology. Digital holography. Application of optical signal processing in speckle metrology. Photo elasticity. Optical fiber sensors. Color measurement, optical metrology based on detection in different colors.

*Irodalom / Literature:* K. J. Gastvik: Optical Metrology, John Wiley&Sons, New York 1995, R.J. Keyes: Optical and infrared detectors, Springer Verlag 1980, R. S. Sirohi: Optical Components, Techniques, and Systems in Engineering, John Wiley&Sons, New York 1992.